

基于Cortex-M3的快速发光二极管光电参数测量系统

汪黎栋, 茅振华, 倪魏

浙江省计量科学研究院, 浙江 杭州 310013

Photoelectric parameter measurement system based on Cortex-M3 for LEDs

WANG Li-dong, MAO Zhen-hua, NI Wei

Metrology Institute of Zhejiang Province, Hangzhou 310013, China

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献](#)

[相关文章 \(15\)](#)

访问总数: 405106

版权所有 © 2012 《光学精密工程》编辑部

地址: 长春市东南湖大路3888号 邮编: 130033 E-mail: gxjmgc@sina.com

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发